

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION
EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle
Bureau international



(43) Date de la publication internationale
29 décembre 2004 (29.12.2004)

PCT

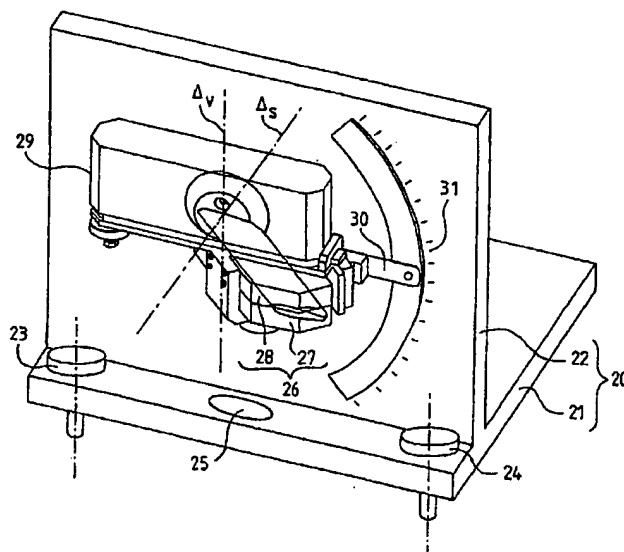
(10) Numéro de publication internationale
WO 2004/113929 A1

- (51) Classification internationale des brevets⁷ :
G01P 13/02, 21/02
- (21) Numéro de la demande internationale :
PCT/EP2004/051125
- (22) Date de dépôt international : 16 juin 2004 (16.06.2004)
- (25) Langue de dépôt : français
- (26) Langue de publication : français
- (30) Données relatives à la priorité :
03 07625 24 juin 2003 (24.06.2003) FR
- (71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US) :
THALES [FR/FR]; THALES, 45, Rue de Villiers,
F-92526 NEUILLY SUR SEINE (FR).
- (72) Inventeurs; et
(75) Inventeurs/Déposants (pour US seulement) :
ROBERGE, Philippe [FR/FR]; THALES INTEL-
LECTUAL PROPERTY, 31-33, Avenue Aristide Briand,
F-94117 ARCUEIL (FR). THOMAS, Dominique
[FR/FR]; THALES INTELLECTUAL PROPERTY,
31-33, Avenue Aristide Briand, F-94117 ARCUEIL (FR).
- (74) Mandataires : COLLET, Alain etc.; THALES Intellec-
tual Property, 31-33, Avenue Aristide Briand, F-94117 AR-
CUEIL (FR).
- (81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de
protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM, AT,
AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO,
CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB,
GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG,
KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG,

[Suite sur la page suivante]

(54) Title: IN-SITU CONTROL SYSTEM, CHARACTERISATION DEVICE AND METHOD FOR CONTROL OF AN ANGLE OF ATTACK PROBE

(54) Titre : DISPOSITIF DE CONTROLE SUR SITE, DISPOSITIF DE CARACTERISATION ET PROCEDE DE CONTROLE D'UNE SONDE D'INCIDENCE



(57) Abstract: The invention relates to an in-situ control system, a characterisation device and a method for control of a moving angle of attack probe, for example, mounted on the skin of an aircraft. The probe comprises a moving vane (15), rotating about an axis (Δ_s) with relation to a probe body (11). The in-situ control device and the characterisation device comprise an enveloping structure (26), for housing the vane (15). The enveloping structure (26) forms the same mechanical reference for the two devices in the determination of the angle of rotation about the axis (Δ_s). The method uses the in-situ control device to control the probe as a function of the characterisation angle thereof.

[Suite sur la page suivante]